PS/DL/Note 79-6 18 septembre 1979

MESURE DES DISTRIBUTIONS TRANSVERSALES DANS LE PS

PREMIERS RESULTATS DE LA MESURE DES PROFILS D'UN FAISCEAU INTERNE PAR L'EMISSION SECONDAIRE D'UN FIL MOBILE

P. Lefèvre

1. RESUME DE LA METHODE ETUDIEE ET DES SPECIFICATIONS INITIALES (1)

Pour mettre au point une méthode simple de connaissance des distributions transversales du faisceau circulant par interaction avec la matière, il fallait s'affranchir de plusieurs difficultés :

- Le choix de mesurer, directement sur le fil, le courant d'émission secondaire permet d'éviter les calculs des trajectoires des particules émises dans l'interaction faisceau-fil.
- Le mouvement du fil à travers le faisceau en place évite tous les problèmes liés au déplacement du faisceau dans une machine non linéaire.
- Il faut, cependant, pour avoir des pertes négligeables et un grossissement limité, obtenir le déplacement rapide d'un fil mince peu diffusant, de bonne tenue mécanique à température élevée.
- La température instantanée doit rester assez basse pour que la thermo-émission ne perturbe pas le signal d'émission secondaire.
- Les particules secondaires doivent être limitées grâce à un champ adéquat de polarisation.

L'ensemble de ces considérations nous a conduit aux spécifications initiales suivantes :

Fil de Carbone ou de CSi	:Ø∿ 30 µm
Vitesse de déplacement maximale	: V = 25 m/s
Intensités du faisceau de protons	: 5 10 ¹¹ à 2 10 ¹⁹ ppi
Energies de mesure	: $T = 800 \text{ MeV} \text{ à } Cp = 26 \text{ GeV/c}$
Grossissements en émittances	: < 2%
Courant d'émission secondaire estimé	: lµA à lmA

Ces spécifications sont extrêmes et pourront être relâchées d'un certain facteur quelque part (par exemple : vitesse, diamètre du fil ou nature du matériau) selon les essais destinés à explorer ce domaine.

2. LES PREMIERS ESSAIS

En dehors de l'étude des divers paramètres, ils ont également permis de démontrer que le système était faisable.

Nous disposions de deux matériaux voisins de nos spécifications :

 <u>Fil de C pyrolitique</u> (ρ = 1,55 g/cm³) déposé sur une âme de SiO₂; diamètres Ø = 25 μm, 38 μm et 64 μm; origine Zvanut comp. (2) Inconvénients : température élevée locale due à une perte d'énergie supérieure dans SiO₂ et à une mauvaise conductibilité calorifique; mauvaise tenue mécanique à haute température.

Avantage : bonne tenue mécanique à température normale.

<u>Fil de CSi</u> (Silicon-Carbide) (ρ = 3 g/cm³); diamètres Ø = 33 μm, 56 μm(4), 75 μm(4), 100 μm(5), 140 μm(5); origine AVCO (3).
 Inconvénient : bien que ce fil ait une remarquable résistance à la traction, il est sensible aux chocs.

Avantage : bonne tenue mécanique à haute température.

Ce matériau est utilisé au Lampf pour les mesures de profil des faisceaux primaires ("wire scanners" ou "harps") (6).

Le montage provisoire s'est fait sur une unité de cible rapide, installée en SS 41 (7). La vitesse moyenne de déplacement horizontal du fil dans le faisceau est 3,3 m/s.

Le fil est isolé du support (fourche de cible) et un générateur HT assure une polarisation négative réglable de 0 à -800 V qui permet l'évacuation des électrons secondaires ; le fil se comporte comme un générateur de courant, dont le signal, via un filtre passe bande (0,3 Hz - 30 KHz), est converti en tension et reçu à la salle de contrôle en différentiel (lmV correspond à 1 µA d'émission (8).

Trois échantillons ont été mesurés : No. 1 C+SiO₂ Ø 64 μm No. 2 CSi Ø 56 μm No. 3

Le signal obtenu est très propre (rapport signal sur bruit supérieur à 100) comme illustré par les photos 1 et 2



1 - Fil No. 2 1 GeV - 2 passages



2 - Fil No. 2 l GeV - Ip \sim 7 10¹²

La photo 1 montre les deux traversées du faisceau, lors du mouvement aller-retour de la cible.

La photo 2 montre, en outre, la déformation du signal due au grossissement du faisceau pendant la traversée puisque la vitesse, dans cet essai, est bien plus lente que celle spécifiée.

Le fil No. l a eu un comportement mécanique correct, mais a été fondu par un essai à 24 GeV/c et 6 10^{12} ppi. Comme indiqué plus haut, on pouvait s'attendre à ce résultat. Les fils No. 2 et 3 ont eu un comportement thermique acceptable, mais ont été cassés mécaniquement au bout de quelques mouvements. Le fil de SiC a une très bonne résistance mécanique, mais certainement une résistance aux chocs insuffisante pour le mouvement de cible utilisée (cet inconvénient disparaîtra, évidemment, dans le système final, puisqu'on envisage un mouvement, certes plus rapide, mais asservi et aux accélérations contrôlées).

3. ANALYSE DES RESULTATS

a) Mesures de dimensions - comparaison avec une cible (9)

Le fil No. l a été mesuré à 6 énergies entre l GeV et 20 GeV/c, et au même instant une mesure de dimension de faisceau a été faite avec la cible verticale de mesure en section 48, celle-ci donnant directement la dimension correspondant à l'émittance à 95% du faisceau (ϕ 95%)

Pour cet essai, on a mesuré la largeur du profil donné par le pied des tangentes d'inflexion (ϕ tgte) ; cette mesure rapide et approximative permet de calculer ϕ 95% si on connaît la distribution ; nous avons pris la forme de distribution connue par l'analyse des mesures des SEM grids à 800 MeV dans le PS (distribution voisine de la distribution parabolique en ρ (r), caractérisée par ϵ 95% = 2,24 ϵ 0, soit ϕ 95% = 1,06 ϕ tgte) (10).

La comparaison de cette mesure (après normalisation en β) avec la mesure par cible, nous a montré un accord à mieux que 5% dans <u>toute</u> la gamme d'énergie.

Une comparaison plus précise, avec analyse du profil, comme fait pour les SEM grids à 800 MeV, ne s'imposait pas puisqu'il subsiste un léger grossissement dû à la vitesse trop lente pour cet essai (il y a environ 5% de pertes par passage, celles-ci devant devenir négligeables à vitesse et diamètre spécifiés).

- 4 -

b) Hauteur du signal

La hauteur maximale du signal Î, pour la distribution considérée, a été calculée à partir des formules données en réf. 1.

$$\hat{I} = eCf \frac{N}{\tau rev} \hat{\rho}_z$$
 avec $C = 4 \ 10^{-2}$ et $f = 1$

C : coefficient d'émission secondaire = $4 \ 10^{-2}$ f : facteur de forme = 1 $\tau rev = \tau \infty / \beta$ avec $\tau \infty = 2,1$ us $\hat{\rho}_z = 1,65/$ \$\phi 95% (pour la distribution \$\varepsilon 95\% = 2,24 \varepsilon 0)

Une comparaison entre \hat{I} mesuré et \hat{I} calculé semble indiquer un comportement de nature expérimentale.



On peut distinguer deux effets dans ce comportement : - la dispersion entre les échantillons, probablement due à la

variation du coefficient C.f en fonction de l'état de surface. Le carbone déposé sur SiO₂ étant naturellement le plus défavorable, tandis que, pour le SiC, on atteint quelque chose de satisfaisant et très proche des calculs.

- la loi de variation, qui peut sembler la même pour les trois échantillons ; le manque de mesure empêche toute conclusion, cependant, il faut considérer qu'il pourrait, ici, s'agir de l'efficacité de l'extraction des électrons secondaires. Il faut donc étudier l'effet du champ de fuite du PS ainsi que les réglages de la polarisation.

Ce phénomène est plus gênant que grave. En effet, il ne semble pas y avoir de déformation de la distribution projetée, simplement la surface n'est pas constante (comme cela devrait être, rappelons $\hat{I} = \frac{cste}{\phi 95\pi}$).

Mais il est indispensable de comprendre cet effet pour garantir une véritable mesure de distribution qui est le but recherché par l'utilisateur de cet instrument.

c) Comportement mécanique et thermique du fil

Le fil de SiC est préférable thermiquement (et probablement aussi pour le vieillissement sous radiations)

Pour continuer les mesures préliminaires, il faut accepter provisoirement le grossissement et prendre un fil plus gros (100 µm).

De toute façon, les mesures se poursuivront (11) avec une cible "modèle 68", après modification des bras, qui, bien que beaucoup plus lente encore, dispose d'un mouvement asservi ; comme on disposera de deux têtes, on pourra garder aussi un fil fin (grossissement encore raisonnable). Une installation dans le sas de la section 90 permettra de rendre plus facile le changement d'échantillons.

On devrait étudier la possibilité d'avoir des vitesses spécifiées moins grandes en diminuant la diffusion par remplacement du Si dans la matrice de C par du Be ; de même, on pourra essayer le comportement d'un fil de Be (12) qui serait, lui, nettement moins diffusant, donc garderait une température basse.

3. CONCLUSION

Les essais réalisés sont suffisamment encourageants, en particulier la remarquable concordance avec les mesures de cibles, pour adopter le principe de la construction d'un système définitif, voisin des spécifications initiales (1). Ce système permettra déjà une mesure des émittances transversales.

Des mesures préliminaires complémentaires permettront de comprendre le problème du niveau du signal en fonction de l'énergie, de relacher les tolérances (soit en vitesse, soit en diamètre) pour SiC, après étude des grossissements, soit même de trouver d'autres matériaux.

A partir de là, la connaissance précise des distributions serait possible, et la voie ouverte à des études importantes sur leur évolution, en particulier de machine à machine, tant dans les cas de distributions inhabituelles (forte contribution de la dispersion Δp , sur la dimension horizontale) que de recombinaisons complexes des faisceaux.

REFERENCES

- PS/DL/Note 78-8 P. Lefèvre Mesure très peu destructive des distributions transversales dans le PS.
- (2) Carl M. Zvanut Comp. Paoli, Pennsylvania, USA.
- (3) AVCO Systems Division Lowell, Massachusset, USA.
- (4) Echantillons et informations fournis par O. van Dyck Los Alamos Laboratories, que nous remercions.
- (5) Echantillons et documents techniques fournis par AVCO, grâce à
 H. H. Hilderbrand Tri Continent, Genève, que nous remercions.
- (6) High intensity beam profile monitors for the Lampf primary beam lines LAUR 79747.
- Développements mécaniques et montages successifs effectués par M. van Rooii et H. Bobillier (Section cible - Groupe Opération du PS).
- L'électronique a été développée et installée par S. Battisti et
 E. Marcarini (groupe CO).
- Les essais ont été faits avec la collaboration de M. Bouthéon et J.P. Potier (groupe OP).
- (10) M. Bouthéon et P. Lefèvre Etudes en cours, à paraître.
- (11) Compte rendu de la réunion du 5 septembre 1979 M. Bouthéon,
 D. Dekkers, P. Lefèvre, J.P. Potier, M. van Rooij, Ch. Steinbach.
- (12) Ch. Steinbach Communication.

Distribution

Chefs de groupe PS C. Johnson JJ Merminod H. Riege M. Van Rooij Y. Baconnier ISR 11 D. Blechschmidt 11 J. Borer 11 K. Hübner 11 E. Jones 11 E. Keil J. Bosser SPS 11 C. Bovet 41 G. Brianti " L. Burnod 11 LR Evans 11 V. Hatton 11 WC Middelkoop 11 M. Rabany 11 W. Scandale 11 G. Shering 11 P. Sievers